### ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Том 267

1975

## УРАВНЕНИЕ «КРИВОЙ ЖИЗНИ» ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

#### В. С. ДМИТРЕВСКИЙ, В. Ф. ГРАФОВ

# (Представлена научным семинаром кафедры электроизоляционной и кабельной техники)

Расчет электрической изоляции, определение ее срока службы требуют знания зависимости времени до ее пробоя от напряженности поля (уравнение «кривой жизни»).

Экспериментальное исследование «кривой жизни» изоляции проведено многими авторами [1—8]. В настоящей работе показывается один из возможных путей теоретического получения уравнения «кривой жизни» изоляции.

Флуктуационная теория разрушения материалов при действии механической нагрузки дает [9]:

$$x = \tau_0 \exp\left\{\frac{W - \frac{e \,\alpha \sigma \,a}{N\left(1 - \frac{2 \,m}{m_{\rm tr}}\right)} \ln \frac{2 \,W N\left(1 - \frac{2 \,m}{m_{\rm tr}}\right)}{\alpha \cdot a \,\sigma \,e}}{2 \,kT}\right\}.$$
(1)

где т — время разрыва образца;

τ<sub>0</sub> — время релаксации колебаний атома в молекуле;

W — энергия разрыва (диссоциации) связи;

*m* — молекулярный вес конца цепи, не воспринимающий нагрузки; *m*<sub>n</sub> — молекулярный вес цепи;

α — коэффициент упорядоченности полимерных цепей, изменяющийся согласно [10] от 1 до 3;

2kT — средняя энергия двух атомов, образующих одну химическую связь.

$$N = \frac{l \cdot N_A \cdot \rho}{M} \,. \tag{2}$$

где N<sub>A</sub> — число Авогадро,

ρ — плотность,

M — молекулярный вес мономерного звена,

*l* — длина связи,

N — число связей, приходящихся на единицу сечения образца,

а — характеризует кривизну потенциальной кривой вблизи ее минимума. Для связи С-С

$$a = \frac{l}{3,22}.$$
 (3)

Разрушение материала определяется величиной подведенной энергии и не зависит от ее природы [11].

В условиях эксплуатации электрическая изоляция подвергается действию электрического поля и механической нагрузки. Увеличение свободной энергии в этом случае составит

$$\Delta W = \Delta W_{9} + \Delta W_{M} = \frac{\varepsilon E_{M}^{2}}{2} + \frac{\sigma^{2}}{2G_{M}} = \frac{\sigma_{9}^{2}}{2G_{M}}, \qquad (4)$$

где є — диэлектрическая проницаемость;

*Е*<sub>м</sub> — напряженность электрического поля;

σ — механическое напряжение;

G<sub>м</sub> — модуль упругости (модуль Юнга); σ<sub>э</sub> — эквивалентное механическое напряжение, создающее в материале такое же увеличение свободной энергии, как и одновременное действие электрической и механической нагрузок.

Подставив в 1 о, определенное из 4 с учетом 2, 3, и обозначив

$$\gamma = \frac{eM \alpha}{3,22 N_A \rho \left(1 - \frac{2m}{m_{\rm u}}\right)};$$
$$Ae^{-bT} = \frac{\alpha e M \sqrt{\epsilon G_{\rm M}}}{3,22 N_A \rho \left(1 - \frac{2m}{m_{\rm u}}\right)}$$

получим

$$\tau = \tau_0 \exp\left\{\frac{W - \sqrt{\gamma^2 \sigma^2 + (Ae^{-bT}E_{\rm M})^2} \ln \frac{2We}{\sqrt{\gamma^2 \sigma^2 + (Ae^{-bT}E_{\rm M})^2}}}{2kT}\right\}.$$
 (5)

Реальные диэлектрики содержат различные неоднородности, приводящие к возникновению локальных напряженностей поля. Максимальную величину локальной напряженности поля при эллиптической форме неоднородности определим [12]

$$E_{\rm M} = \frac{4\nu}{4 + \varkappa + \varkappa \nu} \cdot E; \tag{6}$$

$$\varphi = \frac{\frac{1}{\rho_1} + j \,\omega\varepsilon_1}{\frac{1}{\rho_2} + j \,\omega\varepsilon_2},\tag{7}$$

где  $\rho_1$ ,  $\epsilon_1$  и  $\rho_2$ ,  $\epsilon_2$  — удельное объемное сопротивление и диэлектрическая проницаемость неоднородности и материала соответственно;

Е — средняя напряженность электрического поля.

Если отношение размера неоднородности в направлении поля к ее диаметру у больше 1, коэффициент х найдем

$$\varkappa = \frac{2}{y^2 - 1} \left( 2 - \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}} \ln \frac{y + \sqrt{y^2 - 1}}{y - \sqrt{y^2 - 1}} \right).$$
(8)

Для простоты запишем

$$E_{\rm M} = \beta E, \tag{9}$$

где β — коэффициент концентрации локальных напряженностей поля за счет неоднородностей.

Одним из видов неоднородностей в диэлектриках являются газовые включения. Ионизация в газовых включениях приводит к уменьшению срока службы изоляции в результате следующих процессов:

1) уменьшения толщины изоляции за счет ее разрушения эрозией с поверхности;

2) изменения структуры материала, вызывающего снижение его электрической прочности;

3) создания высоких локальных напряженностей поля в диэлектрике.

Работами Артбауэра показано, что пробой изоляции при напряжении, составляющим только 30% от первоначального пробивного, вызвал уменьшение ее толщины за счет эрозии всего на 5—6% [13]. При длительном действии ионизации в газовом включении за счет химических процессов электропроводность полиэтилена возросла на 4 порядка, а кратковременная электрическая прочность уменьшилась только на 10— 15% [14].

Отказы изоляции при длительном приложении напряжения не могут быть объяснены только эрозией материала или изменением его структуры под действием ионизации в газовых включениях.

Проводимость ионизированного газа высока и v можно положить равным бесконечности. Тогда величина локальной напряженности поля определяется только *y* и средней напряженностью поля. Величину *y* приближенно найдем:

$$y = \frac{h}{2r} , \qquad (10)$$

где *h* — глубина газового включения в направлении поля,

*r* — радиус газового включения или радиус анодного пятна при больших размерах газового включения вдоль эквипотенциальной поверхности.

В случае плоской поры радиус анодного пятна найдем [15]

$$r = \sqrt{2 Dt}$$
, (11)

где *D* — коэффициент диффузии электронов;

*t* — время пробега электроном расстояния между двумя стенками включения *h*.

Время t определим

$$t = \frac{h}{U_e E_{\pi P}},\tag{12}$$

где *U* — подвижность электрона;

Е — пробивная напряженность поля в газе.

Из [16] известно

$$\frac{D}{U_e} = \frac{kT_s}{q_0}.$$
(13)

Решая совместно 10, 11, 12, 13, получим

$$y = \sqrt{\frac{hE_{np}q_0}{8 kT_{g}}}.$$
 (14)

В этих выражениях:

*k* — постоянная Больцмана;

T<sub>э</sub> — электронная температура в газовом разряде;

*q*<sub>0</sub> — заряд электрона.

Полагая Т равным 2000° К, определим значение у при разных h. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

								Табл	ица 1
h [мкм]	5	10	20	50	80	100	200	300	400
y	16	17,1	19	23	26	27	34	37	42
$y_1$	1020	1020	728	298	139	114	26	13	6
β	72	77	88	112	131	137	131	56	22

Выражение (14) дает у в предположении, что радиус анодного пятна равен радиусу электронной лавины. Это явление наблюдается при небольших h. При больших h по стенке поры возникает значительная тангенциальная составляющая напряженности поля, приводящая к появлению поверхностных разрядов. Радиус анодного пятна в этом случае будет определяться радиусом кистевого разряда по поверхности, который определим [17]

$$r = \eta C_{\pi}^2 U^5 \sqrt[4]{\frac{dU}{dt}}, \qquad (15)$$

где п — коэффициент, зависящий от формы приложенного напряжения U,

С — удельная поверхностная емкость,

- скорость изменения напряжения.

В таблице приводится также значение у1, рассчитанное из условия развития разряда по поверхности поры.

Из таблицы видно, что с ростом толщины газового включения у увеличивается, а у1 — уменьшается. По-видимому, при включениях толщиной меньше 100 мкм разряды по поверхности поры отсутствуют и величина локальной напряженности поля определяется газовым разрядом по толщине поры. При толщине поры 200 мкм и более локальная напряженность поля определяется поверхностным разрядом во включении. Из этого предположения по формулам (6-9) вычислено в.

Как видно из таблицы 1, в диэлектрике при наличии газового включения, в котором происходит процесс ионизации, создается высокая локальная напряженность поля Е.

Подставляя Е<sub>м</sub> из (9) в (5), получим

$$\tau = \tau_0 \exp\left\{\frac{W - \sqrt{\gamma^2 \sigma^2 + (Ae^{-b_1}\beta E)^2} \ln \frac{2We}{\sqrt{\gamma^2 \sigma^2 + (Ae^{-b_1}\beta E)^2}}}{2kT}\right\}.$$
 (16)

Если о равно 0, уравнение (16) будет иметь вид

C

$$\tau = \tau_0 \exp\left\{\frac{W - Ae^{-bT}\beta E \ln \frac{2We}{Ae^{-bT}\beta E}}{2kT}\right\}.$$
 (16a)

При обработке результатов экспериментов часто пользуются зависимостью  $\ln \tau$  от *E*. Из соотношения (16а) при *T*=const найдем

$$\ln \tau = B - CE \ln \frac{D}{E}; \qquad (166)$$
$$B = \ln \tau_0 + \frac{W}{2 kT};$$
$$e = \frac{A \beta e^{-bT}}{2 kT}; \qquad D = \frac{2 W e^{bT+1}}{A \beta}.$$

На рис. 1 по уравнению (166) построена зависимость ln т от E. В общем случае получается вогнутая кривая. На рис. 2, 3 приведены экспериментальные «кривые жизни» по данным [1—8]. Теоретическая и экспериментальная зависимости качественно хорошо согласуются меж-



Рис. 1. Теоретическая зависимость lnt=f(E).

ду собой. Количественное сравнение затруднено, так как β является случайной величиной и зависит от вида неоднородностей и их размеров и условий проведения экспериментов.

С возрастанием коэффициентов  $\beta$  долговечность изоляции, как видно из (16а), уменьшается. Приведенные в таблице значения  $\beta$  изменяются от толщины газового включения по кривой с максимумом. Следовало ожидать, что долговечность изоляции от толщины газового включения должна изменяться по кривой с минимумом. Эксперименты, приведенные в [18], подтверждают высказанное предположение.

45



Рис. 2. Зависимость lgт=f(E) в переменном поле для пленок ПЭ (1), ПС (2), ПЭТФ (3), ПТФЭ (4) при нормальной температуре по данным [1].



Рис. 3. Зависимость  $lg\tau = f(E)$  в переменном поле 1, 4 — ПЭ по данным [5, 4], 6, 7, 8, 9, 10 — ПТФЭ по [8, 7, 2, 4, 3], 2 — ПС по [8], 3, 11 — ПЭТФ по [7, 3], 5 — пропитанная конденсаторная бумага KOH-1 по [6], 12 — триацетатная пленка по [3].

Таким образом, долговечность электрической изоляции определяется локальной напряженностью поля, создаваемой неоднородностью ее структуры. Ионизация в газовых включениях является частным случаем неоднородностей с нелинейной характеристикой.

Выведенное уравнение «кривой жизни» можно использовать для обработки экспериментальных результатов по долговечности материалов и прогнозирования срока службы электрической изоляции.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Н. Н. Барабанов, С. Н. Койков, В. А. Фомин, А. Н. Цикин. Ионизационное старение полимерных пленок в широком интервале температуры, напряжения и частоты. «Электромеханика», 1963, № 12, 15—19.

2. Ш. Т. Абзианидзе. Исследование свойств пленки фторопласта с целью применения его для изоляции электрических машин. Научно-техн. бюлл. ЛПИ, «Электромеханика», 1957, № 11.

3. Н. В. Александров, Е. А. Калинина, С. Г. Трубачев. Определение короностойкости электроизоляционных материалов различными методами. «Электричество», 1961, № 4.

4. А. Р. Хиппель. Диэлектрики и их применение. Госэнергоиздат, 1959.

5. R. G. Rhudy, H. E. Mazanek. Accelerated voltage endurance tests. "Power Apparatus and Systems" 1960, № 49, 576-580.

6. Д. С. Варшавский. К вспросу об электрической прочности многослойного диэлектрика из пропитанной конденсаторной бумаги при длительном приложении напряжения частотой 50 гц. Изв. вузов, «Энергетика». 1964, № 1, 19—26.

7. Н. Г. Сахно, А. С. Романов. Влияние частоты на стойкость некоторых полимерных пленок к действию электрического напряжения. Сб. «Обмен опытом в электронной промышленности», 1967, вып. 1, 61—73.

8. Ш. Т. Абзианидзе. О длительной электрической прочности некоторых изоляционных материалов и влиянии на них разряда. Тр. Н. И. Эл. техн. ин-та Совнархоза Груз. ССР, 1961, 1, 75—83.

9. А. И. Губанов, А. Д. Чевычелов. К теории разрывной прочности твердых полимеров. ФТТ, 1962, 4, № 4, 928—933.

10. Ф. Бюхе. Разрывная прочность пластиков ниже температуры стеклования. Физика полимеров (сб. статей). Изд-во ИЛ, 1960, 49—57.

11. А. А. Воробьев. Аналогия и различия при температурном, механическом, термическом и электрическом разрушениях твердых диэлектриков. Сб. «Пробой диэлектриков и полупроводников». Изд-во «Энергия», 1964.

12. Г. И. Сканави, Физика диэлектриков (область сильных полей). Изд. физ. мат. литературы, 1958.

13. I. Artbauer, I. Griac. Der Durchschlag von Kunststoffen unter Einwirkung von Glimmentladungen. "Electrie", 1963, 17, № 4, 120—124.

14. В. Г. Сотников. Влияние частичных разрядов в воздушном слое на некоторые характеристики полиэтилена. Сб. «Электрическая аппаратура и электрическая изоляция». М., «Энергия», 1970, 467—475.

15. Дж. Мик, Дж. Крэгс. Электрический пробой в газах. Изд-во ИЛ, 1960.

16. Ю. Н. Вершинин. Электрический пробой твердых диэлектриков. Изд-во «Наука», СО АН СССР, Новосибирск, 1968.

17. М. Е. Иерусалимов, Н. Н. Орлов. Техника высоких напряжений. Издво Киевского университета, Киев, 1967.

18. Н. С. Ильченко, И. Н. Онищук. Срок службы изоляции при выпрямленном напряжении. Сб. «Ионизационное разрушение, короностойкость и электрическая прочность органической высоковольтной изоляции радиоэлектронного электрооборудования (тезисы докладов)». Изд-во Киевского дома научно-технической пропаганды, Киев. 1969.